

06.1;06.2;06.3;07

©1993

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ГАШЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ

*Л.М.Капитонова, А.А.Лебедев,
А.Д.Ременюк, Ю.В.Рудь*

Фотолюминесценция (ФЛ) пористого кремния (ПК) в видимой области спектра была обнаружена в 1990 г. [1]. С тех пор спектры ФЛ ПК были измерены только при нескольких температурах T [2,3], но сколь-либо подробно зависимость амплитуды ФЛ $I = f(T)$ исследована не была, хотя такая зависимость представляет не только научный, но и значительный практический интерес в связи с широкой перспективой применения люминесценции ПК в электронике.

Образцы ПК были получены путем анодного травления моноцирсталического кремния в HF при плотностях тока 5–80 мА/см² в течение 15–40 мин. Исходное сопротивление исходного кремния было 10 Ом · см, ориентация {111} и {100}. Толщина слоя ПК в разных образцах была 3–15 мкм. ПК светится под действием УФ излучения, причем визуально цвет его свечения бывает — в зависимости от режима травления — от красного до желтого.

Измерения спектров стационарной ФЛ производились при возбуждении перестраиваемым аргоновым лазером ILA-120-1 фирмы "Карл Цейсс". Энергия фотонов возбуждающего света могла изменяться от 2.4 до 2.7 эВ. Как показали измерения, изменение энергии возбуждающих фотонов в указанных пределах не влияет на спектры ФЛ. Температурное сканирование производилось в интервале $T = 77$ –330 К. Измерения спектров ФЛ до и после температурных измерений показали, что они не изменяются в пределах ошибки измерений.

Спектры восьми исследованных образцов были достаточно типичными и имели вид широкой полосы с максимумом при 670–700 нм [1–3]. В процессе температурного сканирования измерялась амплитуда ФЛ в максимуме полосы I_M и энергетическое положение максимума E_M при постоянной интенсивности возбуждения. На рис. 1 показаны температурные зависимости I_M для двух типичных образцов с максимумами ФЛ при комнатной температуре 700 (кривая 1) и 670 нм (кривая 2).

Температурная зависимость I_M немонотонная с максимумом вблизи 210 К (рис. 1, кривые 1,2). Такая зависимость $I_M(T)$ указывает на конкуренцию двух каналов перехода из возбужденного состояния в стационарное — излучательного и безызлучательного. Рост I_M с ростом T в области $T < 200$ К может быть связан с уменьшением интенсивности безызлучательной рекомбинации, температурной зависимостью сечений захвата носителей тока или другими причинами. В данной работе исследовано температурное гашение ФЛ в области $T > 210$ К.

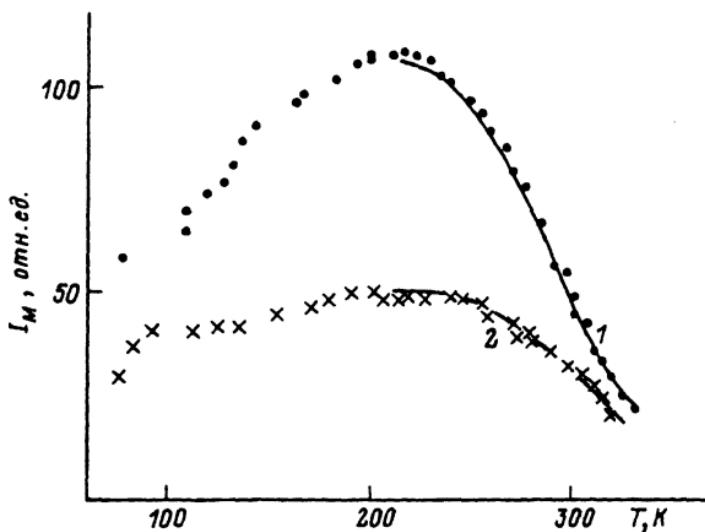


Рис. 1. Температурная зависимость I_M . Кривая 1 соответствует образцу № 1 с $\lambda_M = 700$ нм, кривая 2 — с $\lambda_M = 670$ нм.

Сплошные кривые — расчет при $E_a = 0.29$ эВ для образца № 1 и $E_a = 0.27$ эВ для образца № 2, точки — экспериментальные значения I_M .

Согласно теории, ФЛ в простейшем случае температурное гашение описывается формулой [5,6]:

$$I = \frac{I_0}{1 + A \exp(-E_a/kT)}, \quad (1)$$

где I_0 — амплитуда максимума в области независимости $I_M = f(T)$, E_a — энергия активационного процесса, которая может иметь различный смысл в зависимости от физического механизма тушения.

Следует заметить, что на природу вещества, образующегося при анодном травлении кремния и проявляющего ФЛ с энергией, существенно превышающей E_g кремния, нет единой точки зрения. В большинстве исследований, опубликованных по этому вопросу, считается, что излучение происходит из кремния, превратившегося в систему тонких проволочек и имеющего большую, чем моноокристалл, E_g вследствие квантово-размерного уширения E_g . Одновременно имеются достаточно веские доказательства того, что светящимся веществом является образовавшийся на поверхности подвергнутого анодному окислению кремния силоксан или его производные типа $\text{Si}_6\text{O}_{3+n}\text{H}_{6-m}$ [6]. Таким образом, в случае внешнего тушения E_a связано с энергией ионизации центра, создающего канал безызлучательной рекомбинации, а в случае "внутреннего" тушения она определяется пересечением конфигурационных кривых основного и возбужденного состояний центра [5].

Как следует из формулы (1),

$$\lg \left(\frac{I_0}{I} \right) \sim \frac{1}{T}. \quad (2)$$

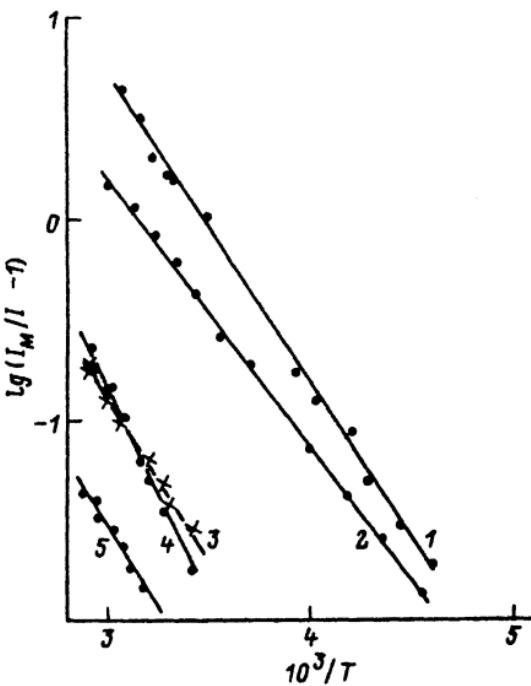


Рис. 2. Зависимость $\lg \left(\frac{I_0}{I_M} - 1 \right)$ от температуры. Кривая 1 соответствует образцу $\lambda_M = 700$ нм; кривая 2 — образцу с $\lambda_M = 670$ нм; кривые 3,4,5 — образцам с $\lambda_M = 700$ нм.

В нашем случае несколько неопределенной является величина I_0 , так как на зависимости $I_M = f(T)$ практически нет участка, I_M не зависит от T . В дальнейших расчетах мы за I_0 принимали величину I_M в максимуме температурной зависимости. На рис. 2 показаны результаты расчетов температурной зависимости интенсивности ФЛ для двух образцов ПК. Из рисунка видно, что в интервале $T = 200$ – 300 К указанная зависимость хорошо выполняется. Из наклона прямых сделана оценка E_a . Для разных образцов она меняется в пределах 0.25–0.35 эВ. По определенной таким образом энергии активации E_a для тех же двух образцов ПК сделан расчет $I_M = f(T)$ и сопоставлен с экспериментальными данными (рис. 1, сплошная кривая). Хорошее согласие вычисленных значений $I_M = f(T)$ с экспериментальными показывает, что принятая нами величина I_0 и значение E_a , определенное из наклона прямой на рис. 2, не слишком сильно отличаются от реальных величин.

Таким образом, в настоящей работе наблюдалось при $T > 210$ К гашение фотолюминесценции. Уменьшение интенсивности фотолюминесценции с ростом температуры имеет активационный характер и описывается классическими формулами гашения фотолюминесценции. При этом согласие расчетных и экспериментальных данных получается при энергиях активации 0.25–0.35 эВ.

Список литературы

- [1] *Canham L.T.* // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 57. N 10. P. 1046–1048.
- [2] *Zheng X.L., Wang W., Chen H.C.* // Appl. Phys. Lett. 1992. V. 60. N 8. P. 986–988.
- [3] *Старухин А.Н., Лебедев А.А., Разбирин Б.С., Капитонова Л.М.* // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 16. С. 60–63.
- [4] *Кори Д.* Люминесценция кристаллов. М.: Ил, 1961. 200 с.
- [5] *Гуревич А.М.* Введение в физическую химию кристаллофоров. М.: Высшая школа, 1977. 336 с.
- [6] *Brandt M.S., Fuchs H.D., Stutzmann M., Weber J., Cardona M.* // Sol. St. Comm. 1992. V. 81. N 4. P. 307–312.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе РАН,
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
12 мая 1993 г.